FT 生产测试站别: IQC

如果发生品质异常请填写"FT品质异常通知单" (Discharge Monitoring Report #) :

可接受质量水平AQL:0.065%

取样方式(Sampling Plan):任意选取

作业人员(Operator):

注意事项Note:

1. 资料核对:

核对流程卡,实物和MES系统三者的数量,品名,规格,批次,出货型号等信息是否一致。

2. 数量清点

□Tray盘来料,请统计每盘Tray IC数量,并相加填写下表。

	=											
序号(盒):	1	2	3	4	5	6	7	合计(PCS)				
数量(PCS):												

3. 外观检验

- A、IC外观、边缘完整无缺、没有裂纹、刮等明显痕迹
- B、Mark内容正确、印制清晰、完整、Mark位置无偏移
- C、BGA球体大小均匀、无缺球、偏移不良
- D、基板有无刮伤、裂痕

FT	生产测试站别:	FT

如果发生良率异常请填写"FT品质异常通知单" (Low Yield Report#):

oad board: SPR-001~003 作业人员:

机台类型 Tester Type	正測程式(Normal Test Program.)	版次 Program Version
Tester:J750HD+P&P OS: Win7-64bits IG-XL Vrsion: 3.60.10		

Tester 设定:

1. 确认当前为WIN7操作系统,IG-XL版本

2. 双击桌面: 0I

3.选择test session: First Test, 如需GU选择"GU Test"

4.根据提示刷入customer LOT ID 等相应信息

5. 点击"ok"

6.待程式TDR run 结束后点击"start test"

Handler 设定:

1.检查Recipe:BGA11*10

2.确认连接Tester: online, GPIB

3.Site mapping 确认: 1 2 3 4

4.确认FT开启Alarm(continue fail),RT时关闭

5. Test bin 设定: **13045**. Test bin 设定: **1304**

Bin Assign						
AUTO1	1	Pass				
AUTO2	6	Fun Fail				
AUTO3	4, 11	Fun Fail				
FIX1	3	O/S Fail				
FIX2	5	Fun Fail				
FIX3	2, E, 15	Fun Fail				

注意事项:1. 技术员setup结束后,测试首盘通知Q检验无问题后方可继续测试,后续每隔3小时QC巡检一次

- 2. RT1良率小于10%则无需RT2
- 3. 如果Bin2 Yield> 0.35% 或最后一次retest bin2的数量大于前一次retest bin2的数量时,请再针对bin2做一次retest.
- 4. 测试PASS品不满盘需单独放置,结批时进行补料动作。

5. EQC Fai1复测2次后若仍有Fai1,需立即联系PE处理。(PE处理时如手动测试Pass, 请PE在Summary EQC数据记录栏签字)

- 6. 针对EQC fail 客户未release的情况,产线先包PASS品,最后留2摞PASS品不包装,fail 品不包装,包装后hold。
- 7. 针对FT yield 未达标或单个BIN fail 超标客户未release情况,产线PASS 品全部包装,fail 品不包装,包装后hold。

Hold 机制:

1. 整批测试结束后: A. 测试良率未达到卡关要求,需HOLD B. 任一卡关BIN別良率超标时,需HOLD

G/F/S开头客批良率卡关: bin1≥95%,Bin2 <0.35%,Bin3<1.61%,Bin4<2.59%,Bin5 <2.24%,Bin6<1.67%

2. Summary 数量和实物数量不匹配,Summary数量比实物少或Summary数量比实物数量多于20ea.

ACE-MFG-QEOR-18 保存期限: 5年

FT 生产测试站别: EQC								
机台类型 Tester Type	正測程式(Normal Test Program.)	版次 Program Version						
Tester:J750HD+P&P OS: Win7-64bits IG-XL Vrsion: 3.60.10								

如果发生品质异常请填写"FT品质异常通知单"(Reject Report #):

抽检频率: AQL0.065 作业人员(Operator):

注意事项(Notes):

- 1.EQC抽測数量: 批次总数< 35K ,EQC 抽样量为: 672颗(4整盘tray); 批次总数>=35K ,EQC 抽样量为: 1512(9整盘tray);
- 2. EQC必须用FT1测试PASS后的产品测试,不可用RT后的PASS品
- 3.EQC复测不能超过3次,测试结束后若有1pcs fail需hold当批,通知工程师处理

4. EQC结束后结批,需清点所有BIN别数量,与runcard核对OK后流入下制程。

FT 生产测试站别: FQC

如果发生品质异常请填写"FT品质异常通知单"(Reject Report #):

作业人员(Operator):

注意事项(Notes):

- 1. 核对runcard数量与实物数量是否一致。
- 2.核对Tray盘型号、Bin 卡内容、Bin标签与Bin的一致性
- 3. 产品Pin1点是否对应Tray盘缺角方向

FT 生产测试站别: PACKING

如果发生品质异常请填写"FT品质异常通知单"(Reject Report #):

作业人员(Operator):

注意事项(Notes):

1. 打带要求: 3短一长,接头处偏移量不可超过1/3

2. Fail 品包装标签上加贴红点

FT 生产测试站别: 0QC1

如果发生异常请填写"FT品质异常通知单"(Reject Report #):

取样方式 Sampling Plan:全检 作业人员(Operator):

注意事项(Notes):

- 1. 内标签(铝箔袋、pizza box)所贴位置、内容
- 2. 抽检部分ICL标签条形码,扫描检验信息,并做好记录
- 3. 整批抽完真空后开始检验,真空失效不大于20%即可通过

FT 生产测试站别: 0QC 2

如果发生异常请填写"FT品质异常通知单"(Reject Report #):

取样方式(Sampling Plan):全检

作业人员(Operator):

- 1. Label检查(内容、破损、打印质量、合批数量)
- 2. 铝箔袋真空封装、外箱包装质量检查.

ACE-MFG-QEOR-18 保存期限: 5年

0

												U		
						Su	mmary	1						
						F	T1					工号:		
Lot No	In put	bin1	bin2	bin15	bin2/15	bin3	bin5	bin6	bin4	bin11	bin4/11	Yield	Loss	外观不良
	1													,
Pass			Fa	iil										
RT1														
Lot No	In put	bin1	bin2	bin15	bin2/15	bin3	bin5	bin6	bin4	bin11	bin4/11	Yield	Loss	外观不良
Pass			Fa	il										
RT2														
Lot No	In put	bin1	bin2	bin15	bin2/15	bin3	bin5	bin6	bin4	bin11	bin4/11	Yield	Loss	外观不良
					ļ						ļ			
Pass			Fa	iil										
]	RT3						_		
Lot No	In put	bin1	bin2	bin15	bin2/15	bin3	bin5	bin6	bin4	bin11	bin4/11	Yield	Loss	外观不良
Pass			Fa	il										
	I					RT4	1	ı			ı	1		ı
Lot No	In put	bin1	bin2	bin15	bin2/15	bin3	bin5	bin6	bin4	bin11	bin4/11	Yield	Loss	外观不良
							-							
Pass Fail														
		I				EQ		Ι					1	I
Lot No	In put	bin1	bin2	bin15	bin2/15	bin3	bin5	bin6	bin4	bin11	bin4/11	Yield	Loss	外观不良
Pass			Fa	il 										
工程验证				<u> </u> 										
Pass			Fa	11l	 Fi	nal Yie	ld 							
							<u> </u>	Ī				Ī	I	<u> </u>
Lot No	In put	bin1	bin2	bin15	bin2/15	bin3	bin5	bin6	bin4	bin11	bin4/11	Yield	Loss	外观不良
Yiel	ld I													
Pass	D:1	L.DACC	Fa		2/4/5 E		£-:1	D:(-	DEC-:1	D:11	D:	15.		
注	Bin! 意意:	1:PASS		I		测试数	:量与来 n1≥95	料数量%,Bin2		Bin11:	: Bir 1.61%, Bin	115: 14<2.59%	, Biná	5
]是:整	批次结	東测试数	据比实	物多出	20ea以	上(若边	三 到请勾定	先" √ ").			



FT 机台落料记录表

机台 (Tester):					产品型号:			生产批号:		
厅县			拾米	¥			处理			
庁号序号	日期 时间	制程	Mark	(ea)数 量	(姓名) 拾 料人员	落料处理方式	(ea)颗 数	(姓名) 处 理人员	备注	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

落料范围: 机台上及周边区域

落料处理流程: 1、检查Mark,确认是否为本批次;

2、若是当前本批产品,确认产品外观有无异常:无异常,放入未测品中进行测试,外观异常,计入0ther外

次品中;

观

3、若不是本批产品,放入BGA落料盒。

落料处理目的: 防止混料

落料处理方式: ① 放入未测品中测试 ② 放入BGA落料盒 ③ 放入Other外次